

[もとのページにもどる](#)

第330回例会のご案内

主催 (社) 日本分析化学会 高分子分析研究懇談会

日時 2005年12月6日(火) 13時30分～19時

場所 ゆうほうと6階「菖蒲」(電話03-3490-5111, JR山手線五反田駅下車徒歩5分)

会場案内図 <http://www.u-port.kfj.go.jp/accs/accs.html>

講演・ワークショップ 13:30～17:00

講演 1 (13:30～14:30) ラマン分光法を用いた迅速かつ非破壊的なポリマーのキャラクタリゼーション

(九州大学大学院 農学研究院森林資源科学部門) 小名俊博

ラマン分光法を用いたポリマーのキャラクタリゼーションは、非常に迅速、簡便かつ非破壊的に実施可能なため、オンライン分析も含め、その応用が期待されている。今回は、分子量、ナノメートルオーダーを含むエマルジョンの粒子直径の定量を中心に、ポリマーキャラクタリゼーションにおけるラマン分光法の可能性について講演する。

ワークショップ 1 (14:40～15:10) Metal-Assisted SIMS (MetA-SIMS)法の紹介と分析例

(株)豊田中央研究所 分析・計測部) 井上雅枝

TOF-SIMS法は表面分析法の一つで、化学構造を保ったフラグメントイオンや分子イオンが検出できるため、無機物だけでなく有機物の分析も可能です。しかし、分子量が1000を超える有機物については、分子イオンを検出できないものもあります。ここでは、そのような高分子量有機物の分子イオンを検出できると同時に検出感度も向上するMetal-Assisted SIMS (MetA-SIMS)法を開発したので、その特徴といくつかの分析例を紹介します。

ワークショップ 2 (15:20～15:50) マイクロサンプリングによる工業製品中の微小異物分析

(日化テクノサービス(株) 技術部) 竹澤 健

近年は電子製品、フィルム、樹脂成形品など各種工業製品中の微小異物が製品トラブルの原因や不良になることが多い。これら数 μm ～数十 μm の微小異物をマイクロサンプリングー顕微IR等で分析した事例を紹介します。

講演 2 (16:00～17:00) 質量分析におけるイオン化の最先端技術

(関西大学工学部 応用化学科) 荒川 隆一

最近、レーザー脱離イオン化(LDI)、エレクトロスプレーイオン化(ESI)を利用した新

しいイオン化の技術が開発され、その応用分野が注目されている。これらDART, DESI, DIOS, Solvent-free, AP-MALDI, 低エネルギーEI, ETD (PTD)の最先端技術について紹介する。また、合成高分子のDIOS-MSへの応用について報告する。

忘年会 17:00～19:00 6階「紅梅」

立食形式の懇親会です。講師を囲んであるいは、会員相互で自由な情報交換を行いたいと思います。参加費は無料ですので是非、ご参加下さい。

申込方法 参加希望者は、氏名、勤務先名、電話、ファックス番号をご記入のうえ、別FAX又はEメールにより下記までお申し込みください。

申込先 〒141-0031 東京都品川区西五反田 1-26-2 五反田サンハイツ304号
社団法人 日本分析化学会 高分子分析研究懇談会

[電話：03-3490-3351, FAX：03-3490-3572, E-mail: hm_tanaka@*jsac.or.jp]

[もとのページにもどる](#)